



光波動場三次元顕微鏡

MINUK

真実を見抜く。未来をはかる。

Features

nmオーダーの透明な異物・欠陥の評価が可能

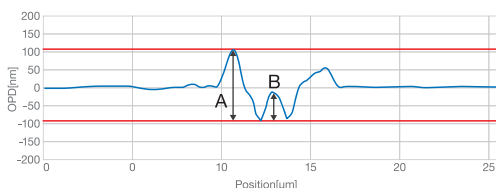
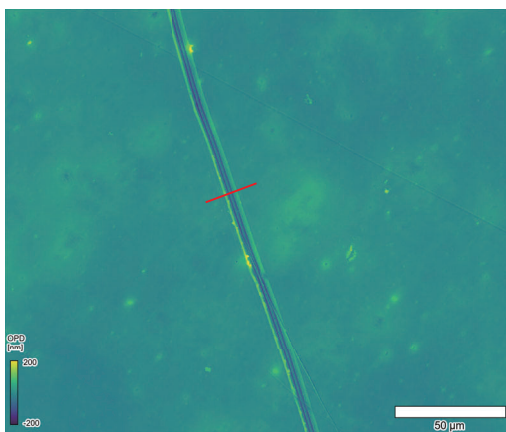
1ショットで瞬時に深さ方向の情報を取得

フォーカス不要で高速測定が可能

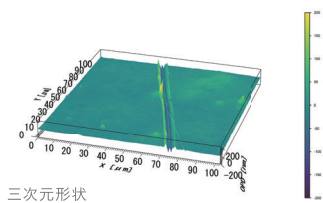
非破壊・非接触・非侵襲で測定が可能

任意の面を高速でスキャンし測定位置の決定が容易

目視では見えない
透明フィルム表面を可視化・定量化



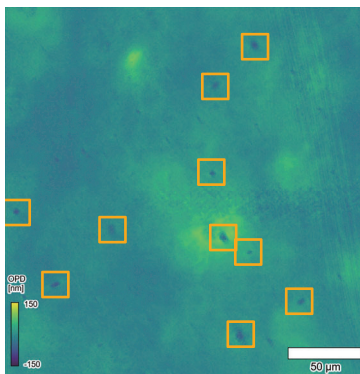
Aの高さ: 約200nm
Bの高さ: 約100nm



nmオーダーの形状情報を非接触・非破壊・非侵襲で取得できます。ワンショットで深さ方向の情報も併せて取得することにより、目視では見えない透明フィルム表面の傷や欠陥の断面形状や三次元形状を可視化し数値化することが可能です。

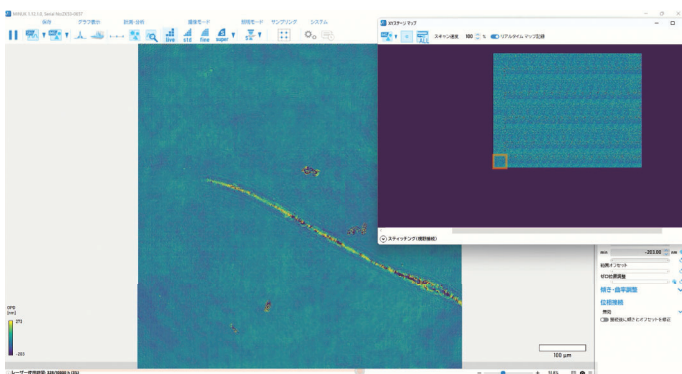
分解能 x, y	691nm(ワンショット)、488nm(合成)
視野 x, y	700×700μm
分解能 z	10nm(位相差)
視野 z	±700μm
サンプルサイズ	100×80×t20mm(汎用サンプルホルダ取付時)
サンプルステージ	微動XYステージ(自動) X:±10mm Y:±10mm 粗動ステージ X:129mm Y:85mm

透明フィルムの内部にあるフィラーを観察



目視では見えない透明フィルム内部にあるフィラーをワンショットで観察することができます。また、測定後に深さ方向へピントを変えていくことにより、各深さでのフィラーを識別することが可能です。

任意の面を高速でスキャンして測定位置を決定



高速で広範囲をマッピングし情報を得ることができるスティッチング機能により、観察したい場所を素早く見つけ、詳細情報を取得することが可能です。

レ ー ザ ー	波長 638nm 出力 0.39nW 以下 Class1 (測定試料への照射強度)
サ イ ズ (幅×奥行き×高さ)mm	本体:505(W)×630(D)×439(H) ±20mm ※PC、付属品は含まず
質 量	41kg
消 費 電 力	本体:290VA ※PC、付属品は含まず

- 記載製品の外観・仕様は、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 会社名、商品名などは各会社の商標・登録商標です。
- このカタログに記載されている内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。

大塚電子株式会社

■本社・営業部 TEL.(072)855-8550 FAX.(072)855-8557
〒573-1132 大阪府枚方市招堤田近3丁目26-3

■東京支店 TEL.(042)644-4951 FAX.(042)644-4961
〒192-0082 東京都八王子市東町1-6 橋完LKビル 2F

■九州営業所:TEL.(092)717-3338 FAX.(092)717-3339
■東海営業所:TEL.(052)269-8477 FAX.(052)269-8478



<https://www.otsuka-el.jp/>

ご質問・ご相談など
お気軽にお問い合わせ下さい